

【1】各種IC、各測定に対応

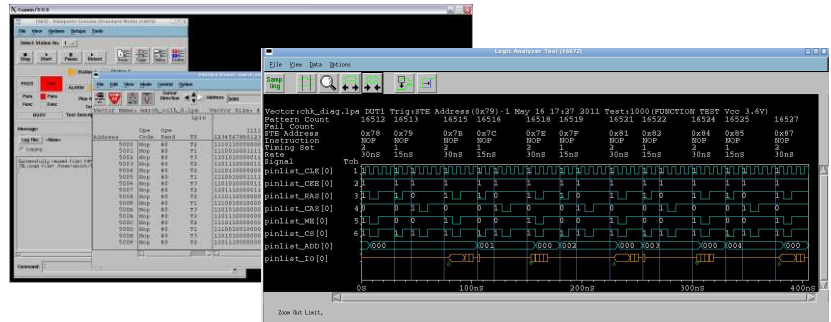
- ロジック/メモリIC
- アナログIC
- パワー系IC
- センサーIC
- etc.各種ICに対応



【2】Go/No-Go Loggingテスト

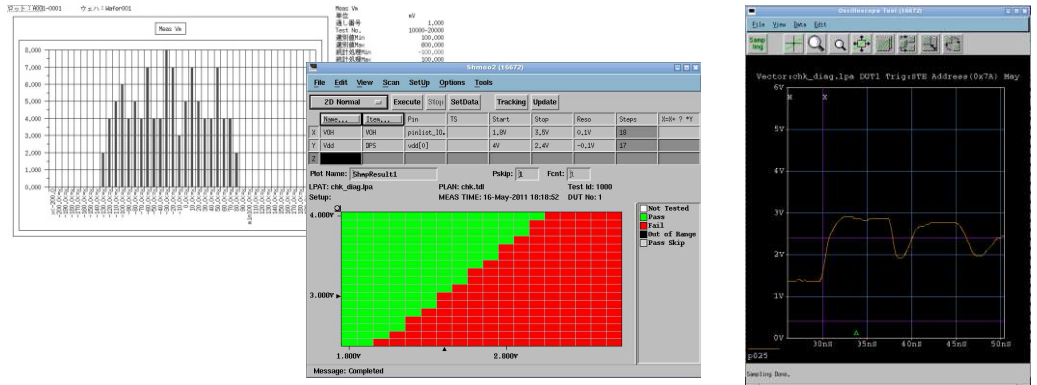
- Functionテスト
- ICCテスト
- DCテスト
- ACテスト

スペックとの比較によるGo/No-Go判定  
データログ出力による実力値調査etc.



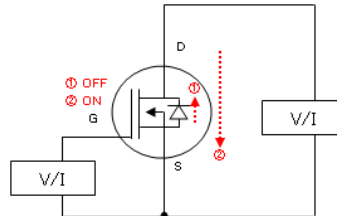
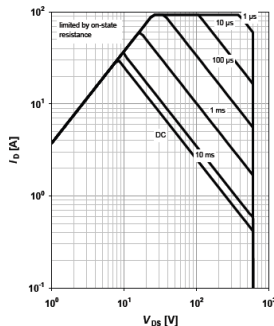
【3】デバイス評価

- Shomooプロット
- ヒストグラムによる分布調査
- 波形調査
- マージン測定
- etc.

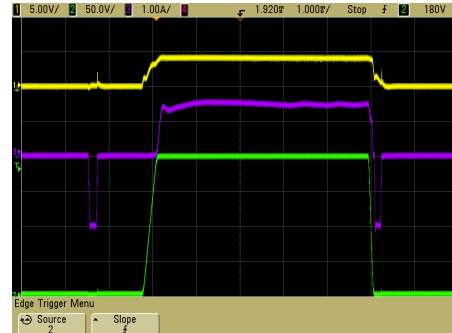


【4】パワー半導体

- 高電圧リーク測定
- 過渡熱抵抗法によるASO検査
- etc.



パワー印加前後のVfを測定し、その差分からジャンクション温度上昇を測定。



MOSFETの過渡熱抵抗法ASO測定例